SM SIMPOSIO **METROLOGÍA** 2020 28-30 octubre Sede CENAM Querétaro, México

Metrología digital en la Infraestructura de la Calidad y la Industria 4.0

Probabilidad y Estadística, Aplicado a Metrología

Fecha: 27 de octubre, 2020

Instructores:

Por confirmar

Temario:

UNIDAD 1. Conceptos básicos de Probabilidad

1.1 Conceptos

1.2 Operaciones (Intersección, Ocurrencia, Condicional y Teorema de Bayes)

UNIDAD 2. Estadística

2.1 Error

2.2 Teorema de límite central

2.3 Medidas estadísticas (media, mediana, moda)

UNIDAD 3. Distribución Normal y función de densidad

3.1 Medidas de dispersión

3.2 Histogramas

3.3 Propiedades y Funciones de densidad

UNIDAD 4. Aplicaciones en Metrología

4.1 Concepto de Incertidumbre

4.2 Regresión lineal

4.3 Error Normalizado

4.4 Estudios r y R.



